

機 器 名	電子顕微鏡 日本電子製 JSM-IT500LA
取 得	令和3年3月
概 要	試料を電子レンズで拡大観察し、元素分析できる。
特 徴	試料の分析業務を更に早く、より楽にできる。 (視野探し容易で観察中も常に元素分析結果表示)
用 途	半導体・電子部品などの表面の異物調査、各種原材料の元素分析。
主な仕様	<p><SEM></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 倍率 5~30万倍 2. 加速電圧 0.3~30kV 3. 検出系 2次電子及び反射電子検出器 <p><EDS></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 検出可能元素 Be~U 2. 定性・定量分析 <p><試料ステージ></p> <p>大型ユーセントリック形 X 125 mm Y 100 mm Z 75 mm 傾斜 -10~+90° 回転 360°</p>
利用業種	電子部品・メッキ工業、車関係、金型関連、大学等の開発研究など多岐にわたる。
<p>【主に測定されるもの】</p> <p>各種部品上の汚れ・異物・欠陥等の観察、元素分析</p>	
<p>【テクノコーディネータから一言】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当電子顕微鏡が最新式に更新されました。 ・試料の写真撮影をし、それを基に観察・分析するため、多くの試料でも短時間で測定可能です。 ・機器操作、測定方法、評価方法について、随時無料講習会を行っております。 	
測定機器写真	測定の様子
	